

# TUZ Call for Papers 2025



Berlin, 23. bis 25. Februar 2025

## 37. ITG / GMM / GI - Workshop Testmethoden und Zuverlässigkeit von Schaltungen und Systemen

### Programmkomitee

J. Alt  
Infineon Technologies AG  
H. Amrouch  
TU München  
B. Becker  
Universität Freiburg  
R. Drechsler  
Uni Bremen und DFKI  
S. Eggensglüb,  
Siemens Digital Industries Software  
P. Engelke  
Infineon Technologies AG  
G. Fey  
TU Hamburg  
A.-P. Fonseca Müller  
Bosch Sensortec GmbH  
M. Gössel  
Universität Potsdam  
S. Hellebrand  
Universität Paderborn  
K. Hofmann  
TU Darmstadt  
S. Holst  
Kyushu Institute of Technology  
W. Hoppe  
Rheinmetall AG  
S. Huhn  
Siemens Digital Industries Software  
M. Kampmann  
Siemens Digital Industries Software  
R. Krenz-Baath  
TH Wildau  
M. Krstic  
Uni Potsdam und /IHP GmbH  
V. Petrovic  
HOL Design House  
L. Bolzani Poehls  
RWTH Aachen  
J. Polian  
Universität Stuttgart  
F. Pöhl,  
Frank Poehl Consulting  
S. Sattler  
Uni Erlangen-Nürnberg  
M. Sauer  
Advantest Europe GmbH  
M. Schillinsky  
NXP Semiconductors Germany GmbH  
H. Schmidt  
IBM Deutschland GmbH  
M. Schözel Hochschule Nordhausen  
J. Sepulveda  
Airbus Defence and Space  
M. Tahoori  
KIT  
D. Tille  
Siemens Digital Industries Software  
M. Wahl Universität Siegen  
H.-J. Wunderlich  
Universität Stuttgart  
F. L. Vargas  
IHP GmbH

Der Workshop „Testmethoden und Zuverlässigkeit von Schaltungen und Systemen“ ist das bedeutendste deutschsprachige Forum, um Trends, Ergebnisse und aktuelle Probleme auf dem Gebiet des Tests, der Diagnose und der Zuverlässigkeit digitaler, analoger, Mixed-Signal- und HF- Schaltungen zu diskutieren. Der Austausch von Ideen ist ein wichtiges Anliegen des Workshops. Erwünscht sind sowohl Beiträge aus der industriellen Praxis als auch von Forschungseinrichtungen. Wir begrüßen stark praxisbezogene Erfahrungsberichte und Ergebnisse ebenso wie Beiträge zu theoretischen Themen unter anderem aus folgenden Bereichen:

- Adaptive Systeme (z.B. Selbstreparatur, self-healing, self-awareness)
- Automatisches Test-Equipment, Testautomatisierung, Testprogramme und Testmodellierung
- Defekt- und Fehlermodellierung
- Diagnose von Ausfallursachen
- Fehlertoleranz, Resilienz, Robuste und strahlenresistente Systeme
- Funktionale Sicherheit
- Hardware-orientierter Test und Hardware-orientierte Sicherheit
- Statistische und KI-Lernverfahren für Test und Zuverlässigkeit
- Test und Simulation von Mixed-Signal, HF- und Analog-Schaltungen
- Testerzeugung, Fehlersimulation, Selbsttest und Online-Test
- Testgerechter Entwurf, DFT Methodik
- Testkosten und Qualität
- Teststandards, z.B. IEEE 1149.x, IEEE 1687.x, IEEE 1838

Der Workshop findet im Konferenzhotel Müggelseeperle in Berlin-Köpenick statt und wird von der Technischen Hochschule Wildau in Zusammenarbeit mit dem IHP organisiert. Es ist geplant die Veranstaltung vollständig in Präsenz durchzuführen. Interessenten werden gebeten, die Zusammenfassung ihres Beitrags im Umfang von maximal 2 Seiten über die Workshop-Homepage einzureichen. Der Beitrag sollte den Zweck der Arbeit, den Neuigkeitsgehalt und Aspekte der Anwendung beschreiben. Angenommene Beiträge werden auf Wunsch in den informellen Workshop-Handout aufgenommen. Hierzu kann der Beitrag auf 4 Seiten erweitert werden.



### Workshop-Homepage

[www.tuz-workshop.de](http://www.tuz-workshop.de)  
**Submission-Seite**  
<https://easychair.org/conferences/?conf=tuz25>

### Wichtige Termine

**Einreichung von Abstracts: 10.11.2024**  
Einreichung finaler Beiträge: 17.11.2024  
Benachrichtigung der Autoren: 20.12.2024  
Camera-ready-paper: 18.01.2025

### Tagungsleitung

Prof. Dr. René Krenz-Baath  
TH Wildau  
E-Mail: [rene.krenz-baath@th-wildau.de](mailto:rene.krenz-baath@th-wildau.de)

### Programmkomitee-Vorsitzender

Prof. Dr.-Ing. Milos Krstic  
IHP – Leibniz Institut für innovative Mikroelektronik  
E-Mail: [krstic@ihp-microelectronics.com](mailto:krstic@ihp-microelectronics.com);

### Veranstalter

GIFA3.5/GMMFA6.5/ITGFA8.2RSS Kooperationsgemeinschaft rechnergestützter Schaltungs- und Systementwurf

